

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 7 月 11 日 (11.07.2002)

PCT

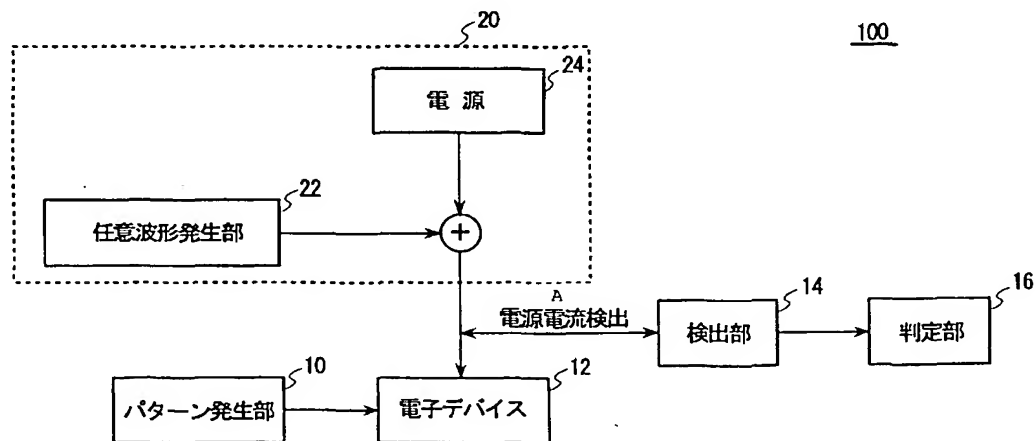
(10) 国際公開番号
WO 02/054093 A1

- (51) 国際特許分類: G01R 31/26 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 古川 靖夫 (FURUKAWA, Yasuo) [JP/JP]; 〒179-0071 東京都練馬区旭町 1 丁目 3 2 番 1 号 株式会社アドバンテスト内 Tokyo (JP). 一宮 正博 (ICHI-NOMIYA, Masahiro) [JP/JP]; 〒779-3122 徳島県徳島市国府町府中 4 6 0 番地 2 号 Tokushima (JP). 橋爪 正樹 (HASHIDUME, Masaki) [JP/JP]; 〒770-0813 徳島県徳島市中常三島町 2 丁目 9 番地 2 号 Tokushima (JP). 為貞 建臣 (TAMESADA, Takeomi) [JP/JP]; 〒770-0868 徳島県徳島市福島 1 丁目 7 番地 5 7 号 Tokushima (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/11623
- (22) 国際出願日: 2001 年 12 月 28 日 (28.12.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2000-401987
2000 年 12 月 28 日 (28.12.2000) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アドバンテスト (ADVANTEST CORPORATION) [JP/JP]; 〒179-0071 東京都練馬区旭町 1 丁目 3 2 番 1 号 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 龍華 明裕 (RYUKA, Akihiro); 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1 丁目 2 4 番 1 2 号 東信ビル 6 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): DE, US.

[続葉有]

(54) Title: LSI TEST DEVICE

(54) 発明の名称: L S I 試験装置



22...ARBITRARY WAVEFORM GENERATING UNIT
24...POWER SUPPLY
10...PATTERN GENERATING UNIT
12...ELECTRONIC DEVICE

A...POWER SUPPLY CURRENT DETECTION
14...DETECTION UNIT
16...JUDGING UNIT

(57) Abstract: An LSI test device comprising a power supply unit for supplying a dc power supply voltage to an electronic device, a detection unit for detecting a power supply current supplied from the power supply unit to the electronic device, and a judging unit for judging the quality of the electronic device, wherein the power supply unit has means of superimposing a superimposing signal with a specific frequency onto a power supply voltage, and the judging unit judges the quality of the electronic device based on a power supply current detected by the detection unit when superimposing signal-superimposed power supply voltage is supplied to the electronic device.

[続葉有]



添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

電子デバイスに直流の電源電圧を供給する電源部と、電源部から、電子デバイスに供給される電源電流を検出する検出部と、電子デバイスの良否を判定する判定部とを備えたLSI試験装置で、電源部は、電源電圧に所定の周期を有する重畳信号を重畳する手段を有し、判定部は、電子デバイスに、重畳信号が重畳された電源電圧に供給された場合に、検出部が検出する電源電流に基づいて電子デバイスの良否を判定する。